

UI300系列 MEMS芯片测试系统

UI300 系列 MEMS 芯片测试系统是由联合仪器推出的基于 PXI 架构的针对 MEMS 传感器的高度集成自动测试系统解决方案。该系统可以通过专用的硬件配合测试软件对 MEMS 传感器进行



一系列的 DC 参数测试和功能测试。广泛应用与 MEMS 传感器开发与调试、生产与下线检测。为了方便用户适用，联合仪器可以提供系统级 API 接口，用户可以根据实际需求进行二次开发。

UI300 系列硬件指标

Model	UI300
Pin Channels	32~224pin (支持多板卡扩展)
Test Rate	10MHz
Parallel Testing Capability	36 DUT (可定制)
Communication	I2C/SPI
PMU	PMU per channel/16bit
DPS	-1V~+10V per site; 512mA MAX
Input Level (VIH/ VIL)	-1 ~ +10V per channel
Output Level (Vc)	-1 ~ +10V per channel
Fail log memory	32M per channel
Rang	2UA,8UA,32UA,128UA,512UA,2MA,8MA,32MA
Vector Memory	32M
Windows/Program Language	Windows7/8/Labview/C&C++

UI300 系列是针对 MEMS 传感器如加速度计、Gsensor、压力传感器、温度传感器、气体传感器等专门设计的测试系统。广泛应用与芯片设计单位、研发机构、封装测试工厂。

使用环境与物理参数

项目	指标
操作温度	0~50 度
操作湿度	95% (无凝结)
存储温度	-20~50 度
存储湿度	95% (无凝结)
外观尺寸	高 357mm (不含底座), 宽 553mm, 深 500mm
主机重量	不大于 50kg

工作电源	220V,50HZ
功率	不大于 1KW



MEMS 传感器自动测试系统软件

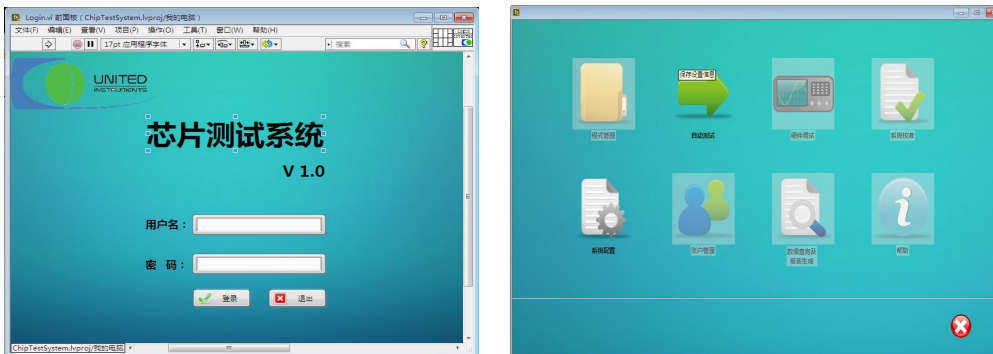
MEMS 自动测试系统测试功能的特色是根据客户测试项分类，操作界面简单易用，可依客户需求提供定制服务。预制测试项如下：

- ◆ Open/short 测试
- ◆ DC 参数测试
- ◆ 功能测试 (I2C/SPI)
- ◆ 负载电流测试

UI300 系列测试软件可运行于 Windows7/8 32bit 或者 64bit 操作系统。

登录模块

用于用户登录测试系统，是 MEMS 测试系统的入口。



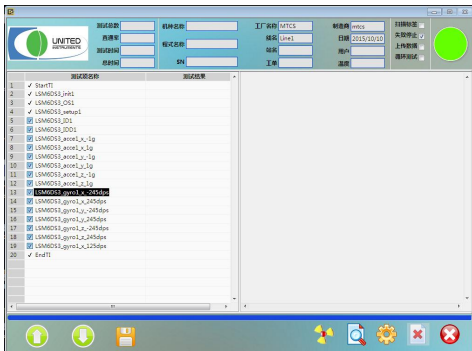
项目信息编辑模块

用户可以根据自己的实际情况，编写生产日期、线体、工单号、良率等等。



项目控制主界面

项目控制主界面，导入测试程序后，勾选需要测试的选项，测试完成后生成测试报表。



应用场合

封装测试厂大规模测试

芯片设计商应用于芯片设计验证

技术服务与保修

测试系统包含 1 年有限质保，对因部件制造缺陷导致的故障提供免费维修。

测试软件的功能与外观可以根据用户需求进行调整。